
Rasterelektronenmikroskopie (SEM)



Leibniz Institute
for high
performance
microelectronics

Technische Parameter

REM System:

Zeiss MERLIN Gemini 2

Primärstrahl: Elektronen 1 - 25 kV

Detektiertes Signal:

- Sekundärelektronen
(SE, InLens, BSE Detektoren)

Lateralauflösung: REM: 2.0 nm @ 25 kV
2.5 nm @ 1 kV



Einsatzgebiete

- Hochauflösenden REM-Aufnahmen

Ansprechpartner

Dr. Ioan Costina

Telefon: +49 335 5625 370

Fax: +49 335 5625 327

Email: costina@ihp-microelectronics.com